PASJ2019 WEOH05

Ninja カソードを用いたニオブ加速空洞の縦型電解研磨(VEP)における研磨量均 ー化と高空洞加速性能の達成

ACHIEVEMENT OF UNIFORM REMOVAL AND HIGH CAVITY ACCELERATING PERFORMANCE ON NIOBIUM ACCELERATING CAVITY VERTICAL ELECTROPOLISHING WITH NINJA CATHODE

仁井 啓介^{#, A)}, Vijay Chouhan^{A)}, 井田 義明^{A)}, 山口 隆宣^{A)}, 早野 仁司^{B)}, 加藤 茂樹^{B)}, 文珠四郎 秀昭^{B)}, 佐伯 学行^{B)}, 沢辺 元明^{B)}, 井藤 隼人^{C)}, 及川 大基^{D)}

Keisuke Nii^{#, A)}, Vijay Chouhan^{A)}, Yoshiaki Ida^{A)}, Takanori Yamaguchi^{A)}, Hitoshi Hayano^{B)}, Shigeki Kato^{B)}, Hideaki Monjushiro^{B)}, Takayuki Saeki^{B)}, Motoaki Sawabe^{B)}, Hayato Ito^{C)}, Hiroki Oikawa^{D)}

^{A)} Marui Galvanizing Co., Ltd.

^{B)} High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

^{C)} Sokendai

^{D)} Utsunomiya University

Abstract

Marui Galvanizing Co., Ltd. started development of internal surface electropolishing technology for niobium cavities, making use of years of experience in electropolishing construction. Focusing on vertical electrolytic polishing (VEP) method, which is superior in cost and suitable for mass production, we have been developing technology and equipment jointly with KEK. We succeeded in greatly improving the uniformity of the removal thickness, which was a major problem of VEP, by developing our unique Ninja cathode and optimizing the VEP parameters. And, in the VEP of the niobium single cell cavity, an accelerating gradient of 32 MV/m (Q_0 =8.0E9), comparable to that of the horizontal electrolytic polishing (HEP) was achieved. Also, in the niobium 9 cell cavity, in addition to the improvement of the Ninja cathode, the flow of the bubbles in the VEP is controlled to improve the distribution of removal thickness and the polishing state, and the accelerating gradient of 28 MV/m (Q_0 = 6.7E9) similar to HEP is achieved. In this presentation, we will report on the results of these VEP technology developments and future efforts.

1. はじめに

近年、International linear collider (ILC)を始めとした、 超伝導加速器の建設計画が進んでいる。ILCではニオ ブ加速空洞を約8000台製造する必要があり製造コスト の削減が課題となっている。これまでは、加速空洞の電 解研磨には横型電解研磨(HEP)が用いられ、超伝導加 速器の製造が行われてきた。HEPはこれまでに技術が 確立され、量産実績が多数ある一方、設備の複雑さや 処理コスト等に課題があると言われている。そこでマルイ 鍍金工業では、まだ技術は確立されていないが、処理コ スト低減を可能にすると言われる縦型電解研磨(VEP)に 着目し、KEKと共同で設備、技術の開発をスタートした。

本論文では、これまでに開発した VEP 設備、クーポン 空洞、Ninja カソードの紹介、これらを用いてニオブ単セ ル空洞、9 セル空洞の VEP を行った結果とそれらの加速 性能評価の結果を報告する。

2. VEP 設備とクーポン空洞の開発

2.1 VEP 設備の開発

これまでに、マルイ鍍金で開発、作製してきた VEP 設備の写真を図1に示す[1]。



2号機 自動2方バルブ 3号機 自動3方バルブ Figure 1: Photos of Marui's VEP facility ver.1-3.

1 号機は配管、バルブとも塩ビ製で、バルブはすべて 手動バルブである。流路の切り替えはすべて手動で、1 つ1つのバルブを操作する必要があった。2 号機は電気 制御の自動バルブを用いて作製した。流路の切り替えは タッチパネルでバルブ操作できるほか、特定の状態のプ ログラムを作成しておき、そのプログラムを選択すること により、すべてのバルブを所定の状態にすることができる。 さらに3 号機では、電気制御の3 方バルブを用いてバル

[#] keisuke_nii@e-marui.jp

Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan July 31 - August 3, 2019, Kyoto, Japan

PASJ2019 WEOH05

ブ数を削減している。また、3 号機では一部テフロンのフ レキシブルチューブを使用している。

2.2 クーポン空洞の開発

VEP 技術の開発やパラメーターの最適化を行うにあたり、評価用のクーポン空洞を作製した[2]。クーポン空洞の構成、写真を図2に示す。



Figure 2: Photos and schematics of coupon cavity (left) single-cell coupon cavity, (right) 9-cell coupon cavity.

クーポン空洞は、空洞に穴をあけて直径 8mm のニオ ブ小片(クーポン)と内部観察用のビューポートを取り付 けた構造となっている。クーポンは空洞本体とは絶縁さ れており、個別に電圧印可、電流測定を行うことができる。 これにより、クーポンを取り付けた各部分(赤道、上下ア イリス部等)の電流分布の評価が可能となる。また、クー ポンは各種表面分析装置にセットすることができ、研磨 後の表面状態を詳細に調べることができる。ビューポート からは、EP 中の空洞内部の様子を見ることができ、カ ソードから発生する気泡の量や流れ方を検証することが できる。

クーポン空洞は、研磨量の均一化や研磨内面の改善 実験で多くのデータが取れるために大変有用であった。

3. Ninja カソードの開発

VEP においてはこれまで、研磨内面の平坦性や研磨 量の均一性に課題があった。この課題を解決するために、 独自構造の陰極「Ninja カソード」を開発、作製し改良を 続けてきた。これまでに開発した Ninja カソードの模式図 を図 3 に示す。Ninja カソードは 1 つのセルに対して複 数の羽根状の部材があり、空洞にセットするときはこれを カバー内部に収納し、EPを行うときはこれをカバーより出 して使用する。また EP 時にはこれを回転して内部の撹 拌を行う。

Ninja カソードの羽根は Verl では金属で作製していた。これにより赤道付近までよく EP できるという利点はあったが、気泡が多く発生して空洞内部に滞留するため、表面の気泡跡や研磨量の不均一発生の原因となった[3]。



Figure 3: Schematics of Ninja cathode ver.1-5.

Ver2 にて絶縁物の羽根としたところ、気泡は減少した が赤道付近によく EP がかからず表面が荒れる問題が あった。Ver3 ではこれらを両立するため絶縁物羽根の先 端に金属の小片を配置した構造とした。これは気泡が少 なくかつ赤道までよく EP できていたが、少量の気泡の影 響が見られた[4]。Ver5 では、羽根は絶縁物とし、カバー 内の電極面積を大幅に増やすとともに、カバーにスリット とメッシュカバーを配置し、EP 効果の増大と気泡拡散の 防止を狙った[5]。

4. 単セル空洞の VEP と加速性能評価

4.1 クーポン空洞を用いた研磨量分布の改善実験

Ninja カソードによる VEP 研磨量均一化と研磨表面改 善を目指して、単セルクーポン空洞と Ninja-ver5 を用い て VEP 実験を行った[5]。

まず、VEP 中の上アイリスと下アイリスのクーポン電流 を図4に示す。



Figure 4: Coupon current of top iris and bottom iris (left) with a rod cathode, (right) with a Ninja cathode ver5.

棒状電極での VEP では上アイリスと下アイリスの電流 に大きな差があり、上アイリスが下アイリスの 2 倍程度の 電流が流れている。対して Ninja-ver5 では、両者の電流 はほぼ同じとなっている。これは、Ninja-ver5 により、空洞 全体の電流分布が均一化されていることを示唆している。 次に、VEP 後の研磨量分布の結果を図 5 に示す。

Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan July 31 - August 3, 2019, Kyoto, Japan

PASJ2019 WEOH05



Figure 5: Removal thickness distribution after VEP (left) with a rod cathode, (right) with a Ninja cathode ver5.

棒状電極では、上アイリス部の研磨量が突出して大き く、他の部分の 2~3 倍となっていたが、Ninja-Ver5 では 2 倍以内となっていた。また、研磨量の上下の対称性も 改善していることが分かった。研磨後の表面状態を図 6 に示す。



Figure 6: Surface status after VEP with a Ninja cathode ver5 and a rod cathode.

棒状電極の場合は、気泡の跡のようなものがあって表面が荒れているのに対し、Ninja-Ver5の場合は赤道、両アイリスとも泡の跡がなく平坦な研磨面となっていた。これらから、Ninja-ver5を用いた VEP は非常に良好であった。

4.2 単セル空洞 VEP と加速性能評価

Ninja-ver5 を用いて 1.3GHz ニオブ単セル空洞(TB1-TSB02)の VEP を行い、縦測定による加速性能評価を 行った[6]。手順は VEP1(36 μ m)→HPR、ベーキング→ アニール→VEP2(10 μ m)→HPR、ベーキング→縦測定 である。VEP1 後に研磨量分布と研磨内面の確認を行っ たので結果を図 7 に示す。研磨量分布は良好であり、研 磨内面も光沢があり平坦であった。



Figure 7: Removal thickness distribution and surface inspection after VEP1.

この空洞の VEP 後の縦測定の結果を図 8 に示す。 32MV/m(Q_0 =8.0E9)の加速性能を達成した。これは、同 空洞の HEP 後の結果と同程度である。これにより、VEP においても HEP と同様の加速性能をだすことが可能で あることが示された。



Figure 8: The results of cavity vertical test after VEP and comparison with after HEP.

5. 9 セル空洞の VEP と加速性能評価

5.1 クーポン空洞を用いた研磨量分布の改善実験

Ninja-Ver5を用いて9セル空洞のVEPを行い、研磨 量分布と研磨内面観察を行ったが、問題が発生した[7]。 これらの結果を図9に示す。

PASJ2019 WEOH05



Removal Thickness (µm)

Figure 9: Removal thickness distribution and surface inspection results after VEP with a Ninja cathode ver5.

研磨量分布は下のほうのセルでは良好であるが、上のセルになるほど分布が悪化していた。研磨表面も同様に上のセル程悪化する傾向が見られた。これは、下の方のセルは Ninja-ver5 の効果により気泡の発生が抑制されているものの、上へ行くほど気泡が蓄積され、その影響で研磨量分布や研磨表面が悪化しているものと考えられる。9 セル空洞 VEP においては、さらなる気泡対策が必要となった。

そこで、気泡を滞留、蓄積させずに素早く排出するため、Ninjaカソードのカバー内部と外部で EP 液流路を分けて、流量を別制御する方法を考案した(2 フロー法)[8]。 カバー内部は素早く気泡を排出するために流量を多く、 カバー外部(空洞内部)では空洞内面に気泡跡がつくこ とを避けるために流量を少なくする。2 フローの模式図と クーポン電流、内部の気泡状態のカバー内流量依存性 確認結果を図 10 に示す。



Figure 10: (Left) a schematic of 2-flow system, (upper right) logged data of coupon current, (lower right) viewport inspection during VEP.

カバー内の流量が 0~5L/min の場合は上下アイリス でクーポン電流の差が見られたが、10L/min では差がな く均一になっていた。また、内部の気泡も10L/min がもっ とも少なくなっていることが分かった。

2 フロー法に加えて、EP 中に電源 OFF 時間を入れる こと(電源カットオフ)により発生した気泡を消滅させること を考案した。確認実験の結果、3min-ON+3min-OFF で 気泡消滅効果が得られることが分かった。この 2 つ(2 フ ロー+電源カットオフ)を用いた VEP 後の研磨量分布評 価結果を図 11 に示す。

2つの改善法により、特に上側のセルの研磨量分布が 大きく改善していることがわかる。



Figure 11: Removal thickness distribution of (left) VEP with 2-flow and cut-off and (right) conventional VEP.

5.2 9 セル空洞 VEP と加速性能評価

これらの方法を用いて 1.3GHz ニオブ 9 セル空洞 (TB9-TSB01)の VEPと加速性能の評価を行った[9]。手 順は VEP1 (100µm) → HPR+アニール→VEP2 (20µm) → HPR+アニール→チューニング→VEP3 (10µm) → HPR+ ベーク→縦測定、である。VEP1,2 後の研磨量分布測定 結果を図 12 に、VEP1 後の研磨内面観察結果を図 13 に示す。



Figure 12: Removal thickness distribution after VEP1 and VEP2.



Figure 13: Surface inspection results after VEP1.

研磨量分布は VEP1、VEP2 とも良好であり、研磨後表 面も光沢があり、平坦であった。また VEP2 前後のフィー ルドフラットネスは 97%→98%とほとんど変化しなかった。 本プロセス後の縦測定の結果を図 14 に示す。



Figure 14: Vertical test results after this VEP.

28MV/m(Q₀=6.7E9)の加速性能を達成した。これは、 同空洞のHEP後の結果と同程度である。これにより、9セ ル空洞のVEPにおいてもHEPと同様の加速性能をだ すことが可能であることが示された。

6. まとめと今後の取り組み

マルイ鍍金工業では、まだ技術は確立されていない が、空洞の製造コスト低減を可能にする縦型電解研磨 (VEP)に着目し、KEK と共同で設備、技術の開発をス タートした。VEP 用の設備と実験用のクーポン空洞、独 自構造陰極「Ninja カソード」を開発、作製し、VEP の課 題である研磨量分布の均一化と研磨内面の改善のため 実験を行った。

Ninja カソードは、絶縁羽根+金属面積増加の Ver5 を 作製し、単セル空洞の VEP 実験を行った。結果、気泡の 影響を抑えることに成功し、研磨量分布、研磨内面とも 良好であることを確認した。縦測定の結果、32MV/m($Q_0=8.0E9$)の加速性能を達成した。 9 セル空洞の VEP においては、さらに気泡対策が必要となり、2フロー法と電源 OFF 時間の挿入を考案した。 これらを実施した結果、9 セル空洞においても研磨量分 布と研磨内面の改善が可能となった。縦測定の結果、 28MV/m (Q₀=6.7E9)の加速性能を達成した。縦測定の 結果は単セル、9 セル空洞とも同空洞を HEP したときと 同程度であり、VEP においても従来の HEP と同様の性 能を出すことが可能であることを実証した。

今後は、ILC 規格である 35MV/m(Q₀=8.0E9)以上を 目指して VEP 実験を続けるとともに、コストの検証やコス ト削減に向けた取り組みを行いたいと考えている。コスト 削減については特にタクトタイムの減少(OFF 時間をなく すなど)と歩留まりの確認、向上に取り組みたいと考えて いる。

謝辞

マルイ鍍金での自動バルブ制御の VEP 設備の開発、 立ち上げ、調整にあたりまして、東日本機電開発株 式会社(岩手県盛岡市)の水戸谷様、赤堀様、宮野 様、株式会社 WING(岩手県北上市)の髙橋様、姉 帯様に多大なご協力を頂きました。ここに感謝の意 を表します。

参考文献

- [1] Y. Ida et al., SRF2019, Dresden, Germany 2019, TUP028.
- [2] S. Kato et al., LINAC16, East Lansing, MI USA 2016, MOPLR038.
- [3] V. Chouhan *et al.*, LINAC14, Geneva, Switzerland 2014, THPP098.
- [4] V. Chouhan *et al.*, SRF2015, Whistler, Canada 2015, THBA02.
- [5] V. Chouhan *et al.*, LINAC16, East Lansing, MI USA 2016, MOPLR037.
- [6] K. Nii et al., IPAC18, Vancouver, Canada 2018, THPAL032.
- [7] V. Chouhan *et al.*, SRF2017, Lanzhou, China 2017, TUPB091.
- [8] V. Chouhan et al., IPAC18, Vancouver, Canada 2018, THPAL030.
- [9] V. Chouhan *et al.*, LINAC18, Beijing, China 2018, TUPO068.